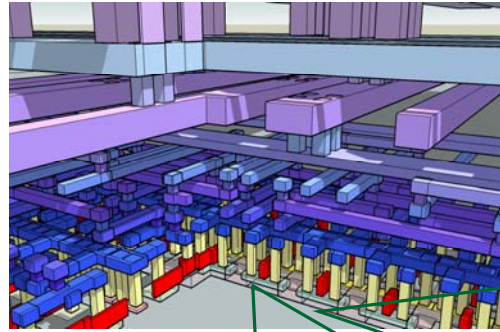
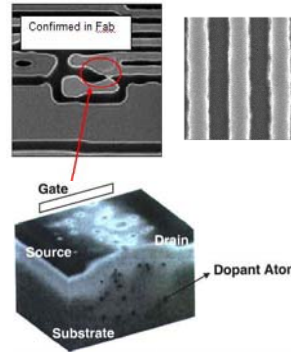


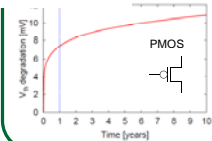
背景



製造ばらつき



経年変化



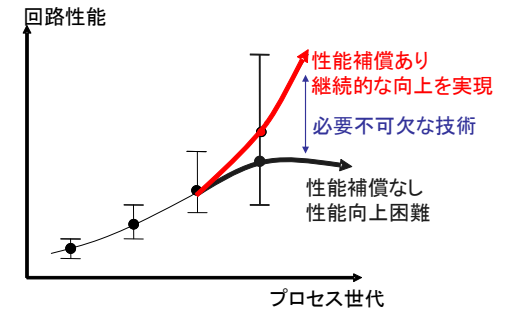
微細化により性能がすべてのチップで異なる

目的

- チップ内での特性ばらつきの深刻化
- すべてのチップが異なる特性

チップごとに適切な性能補償を実現する方式と設計技術の確立

ハイエンドだけでなくあらゆるVLSIに適用できる技術を開発したい



研究プロジェクト概要

